## WO3固体エレクトロクロミックフレキシブルトランジスタの高速動作

Fast operation of a WO<sub>3</sub>-based solid-state electrochromic flexible transistor

O小野里尚記 <sup>1</sup>, Hai Jun Cho<sup>1,2</sup>, 太田裕道 <sup>1,2</sup>(<sup>1</sup>北大院情報科学, <sup>2</sup>北大電子研)

°Takaki Onozato<sup>1</sup>, Hai Jun Cho<sup>1,2</sup> and Hiromichi Ohta<sup>1,2</sup>

(<sup>1</sup>IST-Hokkaido Univ. & <sup>2</sup>RIES-Hokkaido Univ.)

E-mail: takaki onozato6@eis.hokudai.ac.jp

急速な IoT 社会の到来により収集・保存しなければならない情報量は爆発的に増える一方で、 メモリ素子の記憶容量は集積化限界によって頭打ちになることが懸念されている。我々は、導電 率変化とともに光透過率変化を情報として記憶できる新たなメモリ素子としてエレクトロクロミ ックトランジスタ (ECT) に注目している。2016 年に全固体 WO3-ECT を作製、導電率と光透過 率の同時変調を報告したが [Sci. Rep. 6, 25819 (2016)]、デバイスのプロトン化・脱プロトン化には 高いゲート電圧 (~10V) で長時間 (数 10s) 電流を印加する必要があった。そこで高速動作が報 告されているエレクトロクロミックディスプレイ (ECD) と ECT の構造を比較、WO3 に対して対 称なゲート電界を印加しプロトン化・脱プロトン化がスムーズに行えるようソース-ドレイン間に 薄い下部 TCO 層として ZnO 薄膜(導電率:~50 S cm<sup>-1</sup>, 膜厚:30 nm) を挿入した結果、ゲート電 圧の低減 (3 V) と 1 s 以内の高速動作に成功した[AIP Adv. 9, 025122 (2019).]。また、下部 TCO 層 の導電率を変化させることでデバイスの動作は大きく変化し、図 a に示すように導電率を 50 S cm<sup>-1</sup>, 1.5 S cm<sup>-1</sup>, 0.1 S cm<sup>-1</sup> に設定した場合、動作速度はそれぞれ 1 秒、12 秒、28 秒と遅くなって いくが、ON/OFF 比はそれぞれ 40,2000,46000 と大きく得られ、最適値を下部 TCO 層の導電率に よって設計可能である。さらに我々はすべての作製プロセスを室温で行える本デバイスの特徴を 活かし、デバイスのフレキシブル化を試みた。フレキシブル PET 基板上に全固体 WO3-ECT デバ イスを作製(図b)した。図cに示すような曲げた状態(R=30 mm)で動作させたところ、フラッ トな状態と同じように 3V、1 秒での動作に成功した。本デバイスは曲げ可能なウェアラブル端末 などに対応可能な次世代情報表示・記憶装置として期待できる。

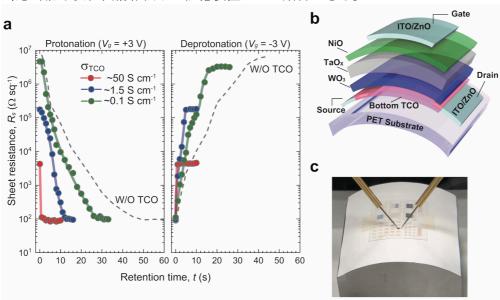


FIG.| (a) Changes in the sheet resistance TCO conductivity dependence. The decay of the sheet resistance  $(R_s)$  when +3 V is applied (left) and recovering of  $R_s$  when -3 V is applied. The result without the bottom TCO is also shown for comparison (dotted lines). (b) Schematic device structure and (c) Photograph of flexible WO<sub>3</sub>-based ECT on curved platform (R=30 mm).